Search Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
09/545,188	WATANABE, KATSUHISA	
Examiner	Art Unit	
Le Nguyen	2174	

	SEAR	CHED	:
Class	Subclass	Date	Examiner
715	734	10/10/2005	LVN
			•
		•	

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

(INCLUDING SEARCH STRATEGY) DATE EX				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DATE	EXMR	
			٠	
USPAT: 709/223	1	0/10/2005	LVN	
		:		
	•	•		
<u></u>			···	